



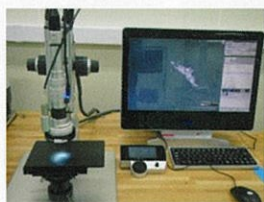
特殊分析

非破壊分析を中心とした分析手法を用いて、製品や原料、製造工程中で発見された異物の分析を実施します。異物発生原因の早急な究明につなげられるよう迅速に分析及び解析を行います。至急分析にも対応しておりますので、ご希望の納期につきましては弊社窓口にご相談ください。また、異物の種類に応じた適切な分析手法の提案もさせていただきます。

さらに、表面イメージングなどの非破壊分析技術により、お客様の製剤開発サポートを実施します。

分析機器

外観観察



デジタルマイクロスコープ



コンフォーカル（共焦点）顕微鏡

内部観察



三次元計測 X線 CT 装置
(μ -CT X ray)

元素分析（金属、鉱物などの無機物）



エネルギー分散型微小部蛍光 X線分析装置
(Micro-XRF)



走査型電子顕微鏡／エネルギー分散型 X線分光装置
(SEM-EDX)

成分分析（樹脂、繊維などの有機物）



FT-IR 顕微鏡



レーザーラマン顕微鏡

元素分析，化学結合状態分析



X線光電子分光分析装置
(XPS)

質量分析



飛行時間型二次イオン質量分析装置
(TOF-SIMS)

X線回折分析



X線回折装置(XRD)